

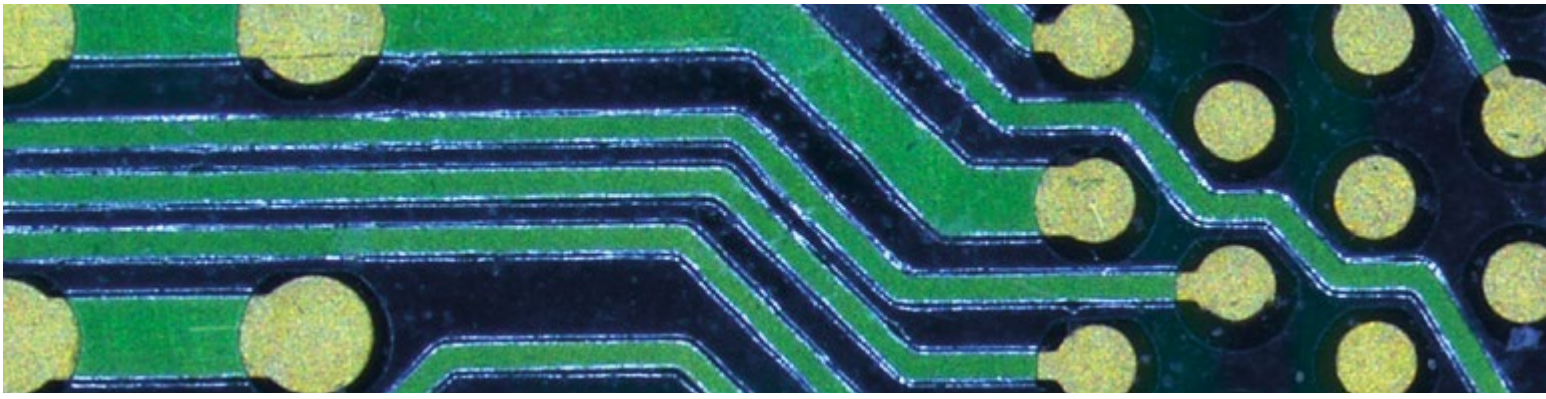
From Eye to Insight

Leica
MICROSYSTEMS

핵심적인 결과를
도출하는 간단한 검사

Emspira 3
디지털 현미경

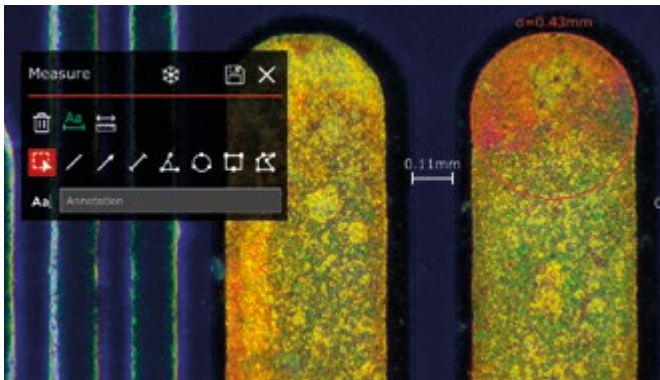




Emspira 3 디지털 현미경은 단일 시스템으로 검사 프로세스를 간소화하고, 검사 요건을 유연하게 충족하며, 안정적으로 검사 과정을 수행할 수 있습니다.

검사 프로세스 간소화 단일 시스템 검사

PC를 사용하지 않고 종합적인 육안 검사 작업을 수행합니다. 내장형 온 스크린 디스플레이(OSD)는 독립형 모드에서 직관적인 도구를 제공합니다. 전용 작업 단계를 사용하기 위해 여러 워크스테이션을 옮겨 다닐 필요가 없습니다.



측정 시 독립형 모드의 내장형 온 스크린 디스플레이를 사용합니다.

PC 없이 육안 검사 중에 직접 측정

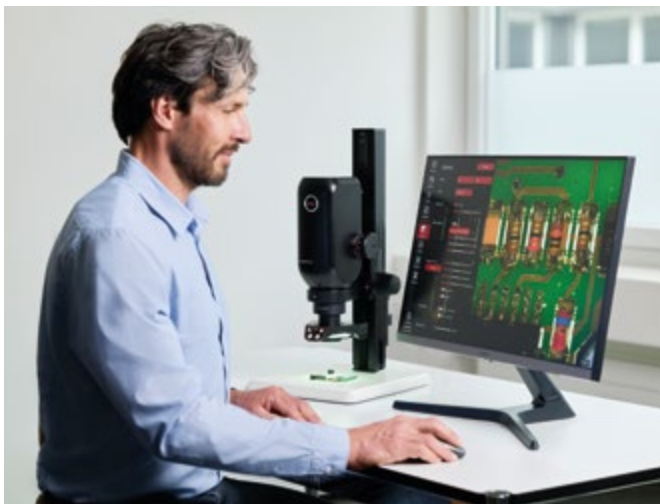
> 독립형 모드에서 실시간 이미지로 시료의 여러 영역을 측정합니다

클릭 한 번으로 참조 이미지와 직접 비교

> 보다 쉬운 결정을 위해 라이브 이미지를 참조 이미지 또는 사용자 지정한 오버레이와 비교하여 부품이 오차 범위 내에 있는지 확인합니다.

빠른 의사 결정을 위해 커뮤니케이션 속도 향상

네트워크 폴더에 이미지를 직접 저장하고 이메일을 통해 동료와 공유합니다.



Emspira 3 디지털 현미경과 표준 베이스 및 LED3000 링 조명.

PC 없이 이미지에 주석 추가

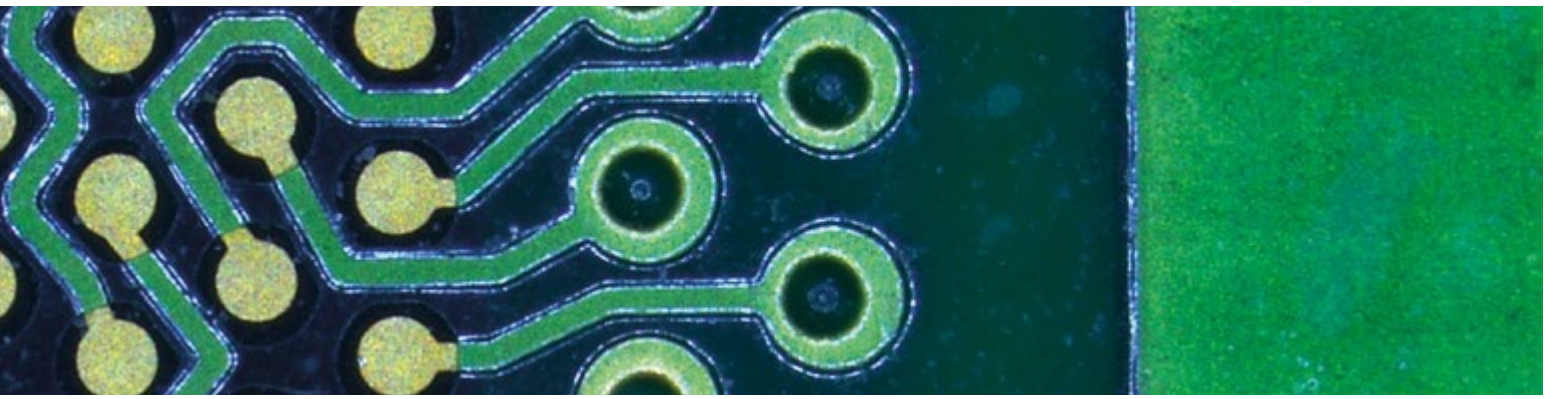
- > 내장형 온 스크린 디스플레이를 사용하여 이미지에 직접 주석을 추가합니다
- > 이미지에 텍스트나 그래픽으로 의견 및 결론을 추가하여 시료의 특징과 관심 영역을 쉽게 강조 표시합니다

네트워크에 이미지 자동 저장

- > 빠른 저장을 위해 이더넷 연결을 사용하여 검사 이미지와 결과를 로컬 네트워크에 직접 저장합니다
- > 핸드/풋 스위치(옵션)의 버튼을 한 번만 눌러 이미지를 동시에 촬영하거나 공유합니다

클릭 한 번으로 결과 이메일 공유

- > PC 없이도 이메일을 사용해 문서를 쉽게 공유합니다



유연하게 검사 요구 사항 충족 다양한 작업에 맞춰 조정 가능

모듈식 설계와 다양한 액세서리 덕분에 Emspira 3을 다양한 시료의 요구 사항에 맞게 사용자 지정하고, 특정 응용 분야의 변화하는 요건에 맞춰 편리하게 조정할 수 있습니다.



Emspira 3은 고객의 요구 사항에 맞게 조정 가능하며 다양한 구성을 지원합니다.

시료에 적합한 조명 사용

> 알맞은 조명으로 관련 세부 정보 표시

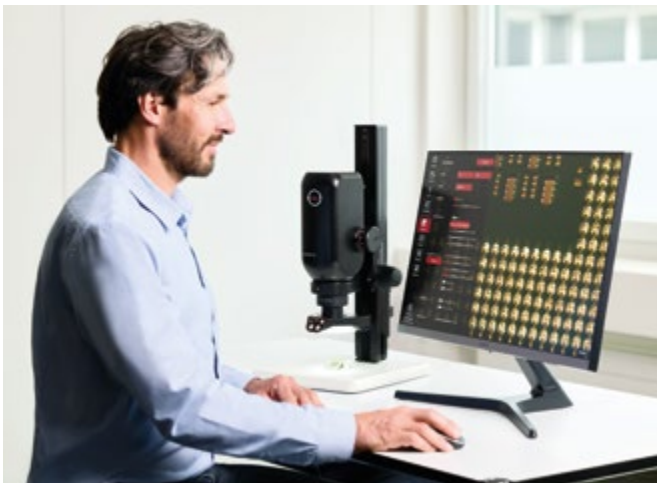
매끄럽게 확대 및 축소

> 8:1 줌 비율로 빠르게 시야 변경

> 인코딩 줌으로 정확한 측정 결과 보장

모든 사람의 사용을 고려한 설계

Emspira 3은 다양한 기술 수준을 가진 사용자를 위해 설계되었으며 최소한의 교육만으로 시스템을 직관적으로 작동할 수 있으므로 시간과 노력을 절약할 수 있습니다. 마우스, 키보드, 터치 디스플레이 및 핸드/풋 스위치 등 원하는 스타일로 작업할 수 있습니다.



내장형 온 스크린 디스플레이가 있는 Emspira 3 디지털 현미경입니다.

조정 가능한 사용자 인터페이스로 간편한 사용법

> 깔끔한 인터페이스를 위한 숨기기 기능

> 인터페이스를 원하는 대로 설정할 수 있습니다

작업에 대한 신뢰

데이터를 언제나 간편하게 활용

결과와 데이터를 로컬 네트워크에 저장하여 데이터 손실 위험을 최소화합니다. 결과 문서에 언제든지 접근할 수 있습니다.

견고한 설계

견고하고 안정적인 설계로 마모와 손상이 낮아 유지보수가 최소화되므로 가동 시간이 극대화됩니다. Emspira 3의 견고한 IP 21 하우징은 가혹한 산업 환경으로부터 내부 광학 및 기계 장치를 보호합니다. AgTreat 항균 표면이 사용자 간에 세균이 확산될 위험을 줄여줍니다.



인체공학적 작업 공간

- > 접안렌즈 없이 모니터에서 직접 4K 해상도로 라이브 이미지 (최대 60fps) 를 확인합니다
- > 바른 자세로 편안하게 검사할 수 있습니다

EMSPIRA 3 장점

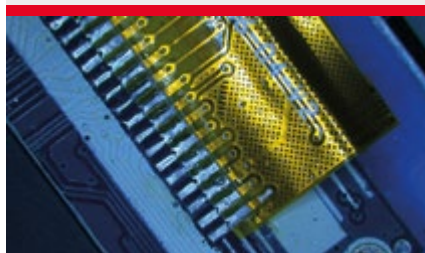
검사 프로세스 간소화

비교, 측정 및 데이터 공유를 위한 통합 솔루션으로 PC 없이 검사 과정을 효율적으로 최적화합니다.



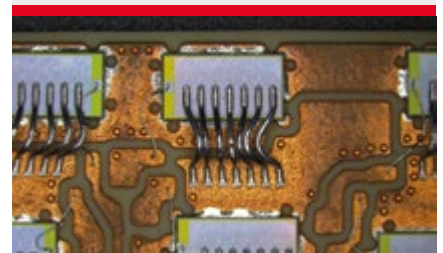
유연하게 검사 요구 사항 충족

원하는 방식으로 작업할 수 있습니다. 다양한 사용자의 요구에 맞게 솔루션을 조정할 수 있습니다.



작업에 대한 신뢰

Emspira 3의 견고한 설계를 통해 생산 및 실험실 환경 어디에서든 자신 있게 안정적으로 검사 과정에 집중할 수 있습니다.



LEICA의 소식을 놓치지 마세요!

Leica Microsystems GmbH · Ernst-Leitz-Straße 17-37 · D-35578 Wetzlar
T +49 (0) 6441 29-4000 · F +49 (0) 6441 29-4155

www.leica-microsystems.com

